⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ® 公開特許公報(A) 平2-37655

Slnt. Cl. 3

識別記号

庁内簽理番号

@公開 平成2年(1990)2月7日

H 01 J 37/305 H 01 L 21/027 7013-5C

8831-5F 7376-5F H 01 L 21/30

3 4 1 B 3 5 1

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

会発明の名称

リングラフィ装置用制御板の製造方法

②特 願 平1-137321

②出 願 平1(1989)5月29日

優先権主張 1988年5月31日@西ドイツ(DE)@P3818535.0 ②発明者 ウオルフガング、ベネ ドイツ連邦共和国ベル

ドイツ連邦共和国ベルリン30、ジギスムントシュトラーセ

5

ケ ⑫発 明 者 ウベ、シュナーケンベ

ドイツ連邦共和国ペルリン21、ピルケンシュトラーセ10

ルク

⑩発 明 者 ブルクハルト、リシユ

ドイツ連邦共和国ミュンヘン82、インデアホイルス13

ケ

勿出 顧 人 シーメンス、アクチェ

ドイツ連邦共和国ベルリン及ミユンヘン(番地なし)

ンゲゼルシヤフト

個代 理 人 弁理士 富 村 潔

### 明報 書

- 1. 発明の名称 リソグラフィ装置用制御板の 製造方法
- 2. 特許請求の範囲
  - 多数の粒子プローブ(14、14°)で付 勢される期間板が、粒子プローブ(14、1 4°)を通すための切欠部(10)を備えた 半導体層(2)及び粒子プローブ(14、1 4°)の数と一致する数の傷向素子(9、9°)を育する形式のリッグラフィ装置用の制御板を設造する方法において、

半導体基板 (1) の表面に第1 誘電層 (2) をまたその背面に第2 誘電層 (3) を設け、 金属層 (4) を第1 誘電層 (2) 上に折出させ、

第2誘電層(3)を半導体基板(1)に製造すべきスルーホール(10)の寸法に相応 して構造化し、

製造すべき傷向素子(9、9°)の寸法及び配置を金属層(4)上に箍されたフォトレ

ジスト暦 (8) 上にリソグラフィで転写し、その際フォトレジスト階 (8) の厚さが傷向素 子 (9) の高さを上回るようにし、

フォトレジスト層 (8) 中に作られた凹部 を傾向案子 (9) の所望の高さまで電着により遊たし、

フォトレジスト暦(8)を除去し、

半導体基板(1)の背面をエッチング処理 することによりスルーホール(10)を形成 し、

スルーホール (10) の範囲内の金属層 (4) 及び第1誘電層 (2) をエッチング処理により除去する

ことを特徴とするリッグラフィ装置用制御板の製造方法。

2) 多数の粒子プローブ(14、14')で付勢される制御板が、粒子プローブ(14、14')を通すための切欠部(10)を確えた半導体器(2)及び粒子プローブ(14、14')の数と一致する数の偏向素子(9、9')

## 特開平2-37655(2)

を有する形式のリングラフィ装置用の制御板 を製造する方法において、

半導体基板(1)の表面に第1誘電器(2)をまたその背面に第2誘電器(3)を設け、

金属層(4)を第1誘電層(2)上に折出

第2 読電層(3) を半導体基板(1) に製造すべきスルーホール(10) の寸法に相応して構造化し、

会議層を第1中間層(11)及び第2中間 層(12)で覆い、その際第1中間層(11) の厚さが形成すべき偏向素子(9)の高さを 上回るようにし、

製造すべき偏向常子(9)の寸法及び形状を第2中間度(12)上に施されたフォトレジスト層(5)上にリソグラフィにより転写

フォトレジスト層 (5) の標識をエッチング処理により第1及び第2中間層 (11、12) に転写し、

御板が、粒子プローブを過すための切欠部を備えた半部体層(ダイアフラム)及び粒子プローブの数と一致する数の偏向素子を有する形式の、リソグラフィ装置用の制御板を製造する方法に関する。(世来の技術)

米国特許第4724328号明知書からリソグ
ラフィ装置(電子ピーム記録器)は公知であり、
その電子光学柱状体は多数の個々に偏向可能の電子プローブを得るための閉口絞りを有する。欧州
特許出願公開第191439号明細書に詳述されている開口絞りは主として列状の多穿孔構造を有するシリコンのダイアフラムからなり、その表面には偏向単位として作用する電極系が配置されている。

# [発明が解決しようとする課題]

本発明の課題は、多数の粒子プローブで付勢される制御板が半導体層及び粒子プローブの数に相応する数の偏向素子を有する形式の、リッグラフィ装置用の制御板を製造する方法を提供することにある。

第1中間層 (1 1) 中に形成された凹部を、 偏向素子 (9) の高さまで電着により換たし、 フォトレジスト層 (5) 及び中間層 (1 1、 1 2) を除去し、

スルーホール(10)を半導体基板の異方 性エッチングによりウエハの脅面に形成し、

スルーホール(10)の範囲内の第1誘電 層(2)と金属層(4)をエッチング処理に より除去する

ことを特徴とするリソグラフィ装置用劇御板 の製造方法。

- 3) 半導体基板(1)がシリコンからなり、このシリコンが(1,0,0)配向を有することを特徴とする額求項1又は2記載の方法。
- 4) 半導体基板(1)がシリコンからなり、このシリコンが(1, 1, 0)配向を有することを特徴とする請求項1又は2記載の方法。
- .3. 発明の詳細な説明

## 〔庭業上の利用分野〕

本発明は、多数の粒子プローブで付勢される制

## (課題を解決するための手段)

この課題は本発明によれば特許請求の範囲の請求項1及び2に記載した方法によって解決される。 請求項3及び4は本発明方法の有利な実施態機を 示すものである。

## (発明の効果)

本発明により得ることのできる利点は特に、本 発明方法により製造された偏向素子がマイクロエ レクトロニクス分野で通常に用いられる制御電圧 で付勢され得ることである。

### (実施例)

次に本発明を図面に基づき辞述する。

第1回に略示した制御板は主として、多放射源から発せられる粒子プローブ 14、14 \*を通すための窓10及び相応する数の偏向素子9、9 \*(これはポンド・パッド7、7 \*及び接続導体を介して、電子又はイオンビームリングラフィ装置.の助御信号発生エレクトロニクスに接続されている)を備えた単結晶半導体基板1からなる。多放射源としては特に、制御板の上方に配置されかつ

# 特開平2-37655(3)

大表面の一次粒子ピームで付勢される、切欠郎を 有する絞りが考慮される。粒子プローブ 14、1 4 \* の各々には制御板の偏向素子9、9 \* が所属 し、これによりその部皮の粒子プロープ14、1 4 を個別に偏向し、場合によっては帰線病去す ることができる(当核粒子プローブを光線路内で 制御板の下方に配置された絞りに傷向させる)。 傷向素子9、9°及び場合によっては強化された ポンド・パッド7、7、を製造しまた誘電体2で 被覆された半導体基板1に接続させるには、リソ グラフィ法及び電着成形技術を使用することが好 ましく、この場合リソグラフィは製造すべき構造 体の寸法及び形状との関連においてUV又はシン クロトロン光線で実施する。偏向素子9、9~の 高さは、数10 mm 、特に10~100 mm であ り、従ってマイクロエレクトロニクスでの通常の 制御電圧で加工することができる。

第1図に示した制御板を製造する方法は本発明 においては次の処理工程を含む(第2図参照)。

- 半導体基板1例えば(1,0,0)又は(1,

1.0)配向を有するシリコン上への、第1 続 電暦 2 例えば窒化珪素又は酸化珪素階の折出 ( 第2 図 a b)

- 基板下面への第2 誘電層3、例えば筺化珪素又は酸化珪素の折出(第2図b)、
- 続電層2への、金原製電気めっき出発層4、 例えばクロム・金又はチタン・金層の折出(第 2回c)、
- 誘電暦3に遠心墜布されたフォトレジスト暦6への、芸坂スルーホール10の寸法のリソグラフィ転写、及び誘電暦3のエッチング(構造化)(第2図d、e)、
- 電気めっき出発簡4に遠心堕布されたフォトレジスト暦5への、接続導体及びボンド・パッド7、7′の寸法及び形状のリソグラフィ転写(第2図d)、
- 接続導体7の電気めっき補強及びフォトレジスト層5の除去(第2回e、()、
- フォトレジスト層 8 でのウェハ表面の被覆( その厚さは形成すべき偏向素子 9 の所望の高さ

よりも大きい)(第2図g)、

- フォトレジスト暦 8 への、偏向素子 9 の寸法 及び形状のリソグラフィ転写(第 2 図 h)、
- フェトレジスト暦 8 に製造された凹部の、偏向素子 9 の所望の高さまでの電気めっきによる 充域(第 2 図 h)、
- フォトレジスト暦8の除去(第2図i)、
- 基板スルーホール 1 0 を得るための、ウエハ ・背面での半導体基板 1 の温式化学的異方性エッチング(第 2 図 3 )、
- スルーホール 1 0 の範囲内での誘電層 2 及び電気めっき出発層 4 のエッチング (第 2 図 ))。本発明の別の方法によれば、偏向素子 9 は三階技術を使用することによっても製造することができる。この処理は第 3 図に基づき説明する工程を含み、この場合には第 2 図 1 に示した構造体から出来する
- ~ レジスト又はプラスチック 1.1 (例えばポリイミド)でのウェハ表面の被覆 (この厚さは、これが形成すべき傷向素子9の高さを上回るよ

うに構成する)(第3図a、b)、

- 第2中間暦12、例えば窗化・アルミニウム 又は珪素の塗布(第3図b)、
- 中間原12上に遠心塗布されたフォトレジスト層5への、偏向素子9の寸法及び形状のリソグラフィ転写(第3図b、c)、
- ~ 中間層 1 1 及び 1 2 のエッチング (構造化) (第3 図 d)、
- 第1中間磨11内に製造された凹部の、偏向 素子9の所製の高さまでの電気めっきによる充 域(第3図e)、
- つまトレジスト度5及び中間度11及び12の除去(第3図1)、
- スルーホール10を得るための、ウェハ背面での基板1の温式化学的異方性エッチング(第3図g)、
- スルーホール10の範囲内での誘電備2及び電気めっき出発層4のエッチング(第3図g)。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は製造すべき制御板の略示図、第2図及

び第3図は制御板を製造するための処理工程図で

ある.

1 … 半導体基板

2、3…贫電層

4 …金属層

5、6…フォトレジスト層

7、7 ~ …ポンド・バッド

8…フォトレジスト層

9、9 "…偏向素子

10…スルーホール

11、12…中間層

14、14~…粒子プローブ

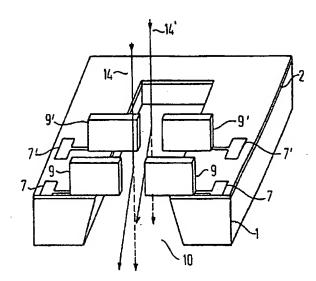


FIG 1

(6118) 代現人 赤斑土 京村

